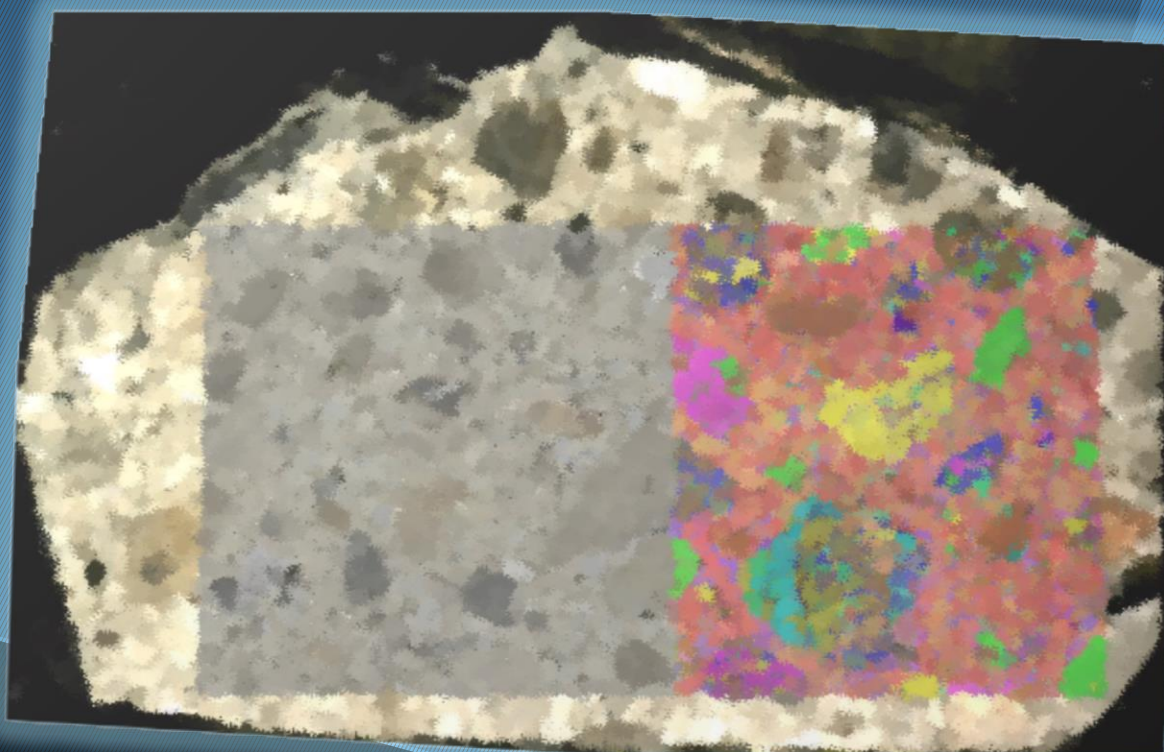




SEMサポーター

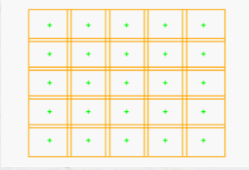


TEMography
.com

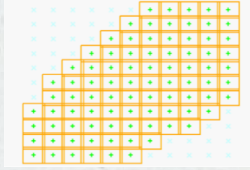
標準機能

広域視野撮影

【タイル状】

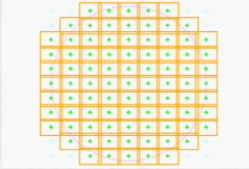


【スキップ指定】

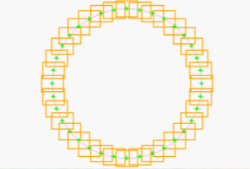


- ▶ SEM画像の撮影パターンをテンプレートとして多数用意。目的などに応じて選択すれば、自動的にそのパターンで撮影できます。
- ▶ 隣接視野と重ねながら撮影すれば画像の位置ずれを自動で計算します。撮影された画像は、そのままひとつの画像ファイルとして保存します。ビューワーソフトウェアは、画像を合成して広域像として表示します。

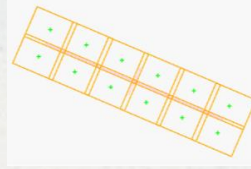
【円形】



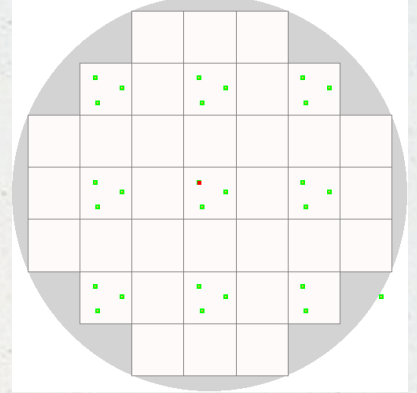
【円周】



【水平/垂直】



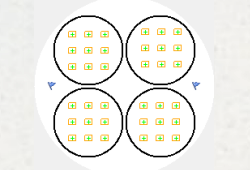
【チップ検査】



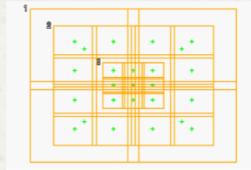
【格子状】



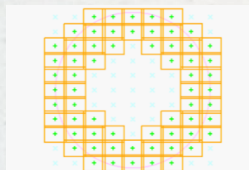
【マルチホルダー】



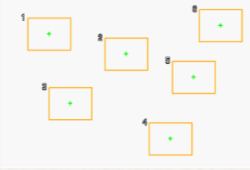
【多重倍率】



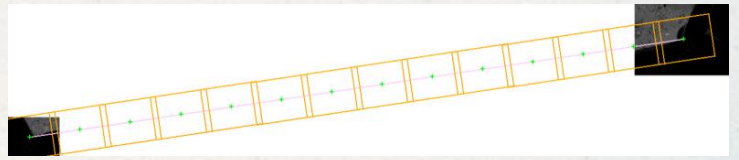
【ドーナツ型】



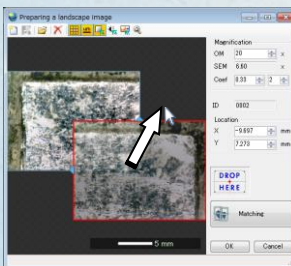
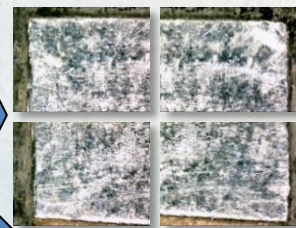
【フリー】



【画像間】



相関観察

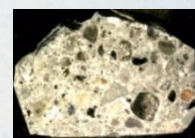


合成：手動配置&自動位置合わせ
《低倍率画像→広域OM画像》

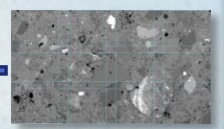
広域OM画像

光顕画像とSEM画像の重ね合わせ

光顕像



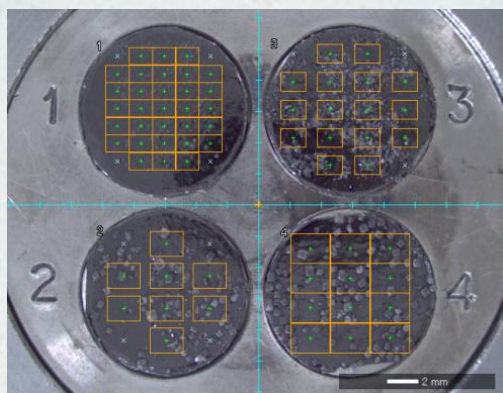
SEM像



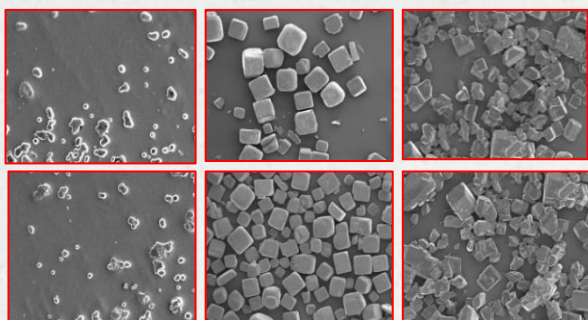
透過の変化具合を動画として保存する事ができます。



サンプリング撮影 & 粒子計測



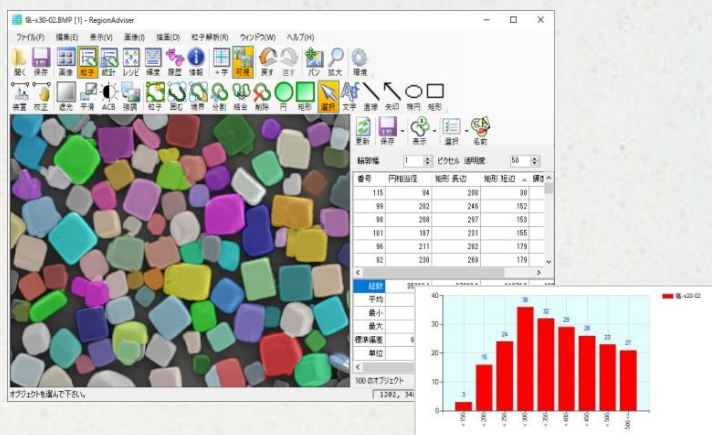
- ▶ 試料毎に複数の視野を自動的に撮影する事ができます。
- ▶ 弊社製粒子計測ソフトと組み合わせる事によって撮影と同時に粒子計測を行う事ができます。
- ▶ 粒子計測ソフトは、2次電子/反射電子像のコントラストから粒子径測定や粒子数計測が簡単に行なえます。また、複数のファイルを一括して測定する事ができます。
- ▶ 統計結果として度数分布表をグラフで出力する事もできます。



粉ミルク

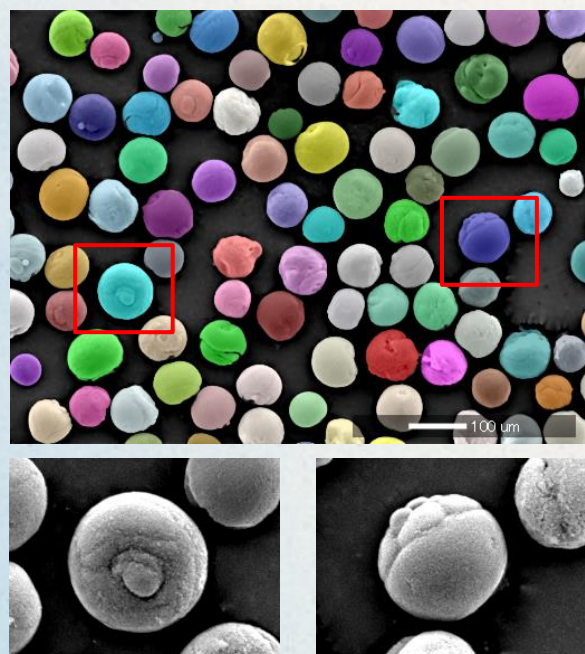
塩

砂糖



センタリング & ズームアップ

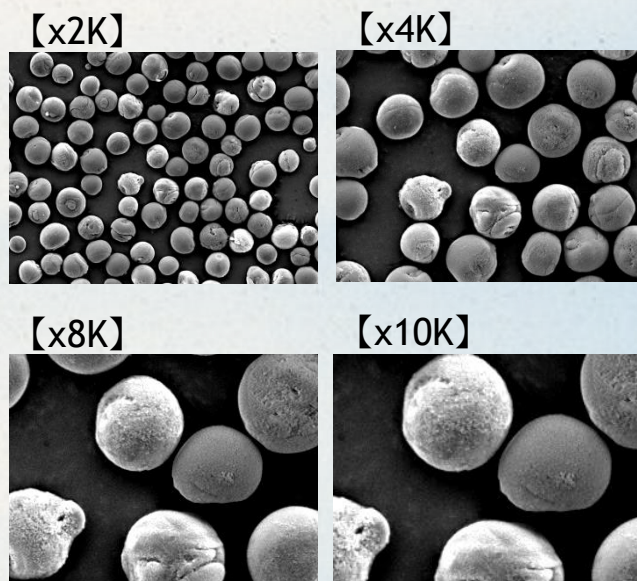
検出された粒子の中から任意の数の粒子を自動的にピックアップして拡大撮影する事が出来ます。



※倍率によって中心位置のずれが発生する場合があります。

マルチズームアップ

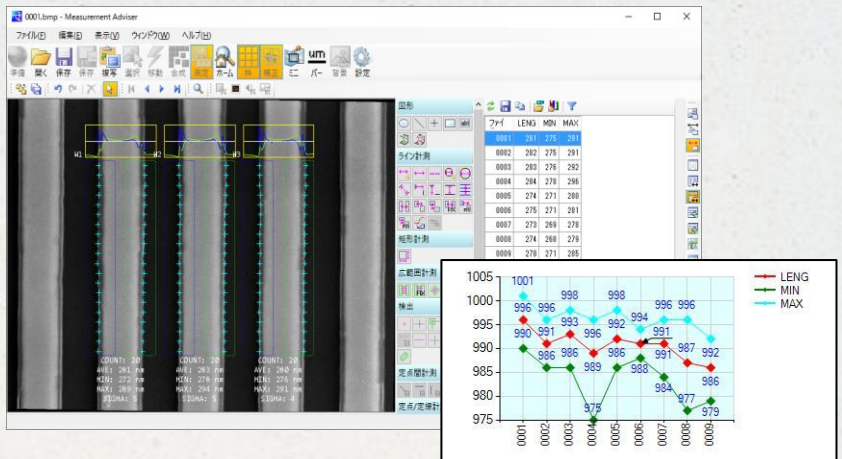
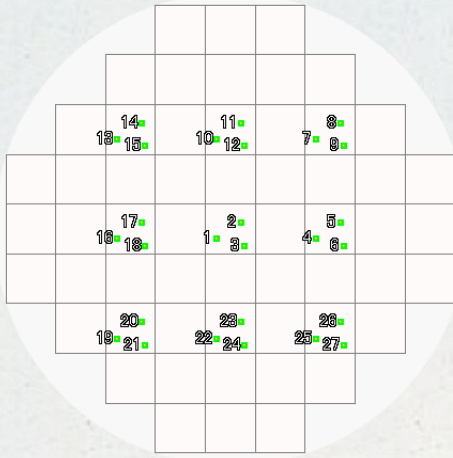
登録された倍率以外に同じ位置で複数の倍率を撮影する事が出来ます。



※倍率によって中心位置のずれが発生する場合があります。

定点観察 & 線幅計測

- ウェハ検査を行う場合、観察するチップ内の同一位置の視野探しを簡単に行う事ができます。
- 弊社製測長ソフトと組み合わせる事によって撮影と同時に測長を行う事ができます。
- 測長ソフトは、SEM像のコントラストから自動的に線幅の測長が行なえます。また、測長の操作はマクロとして記録する事ができますので複数のファイルを一括して測定する事ができます。



計測項目

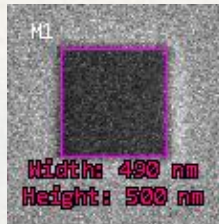
【直線測長】



【BOX測長】



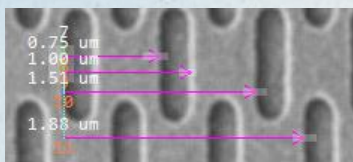
【矩形測長】



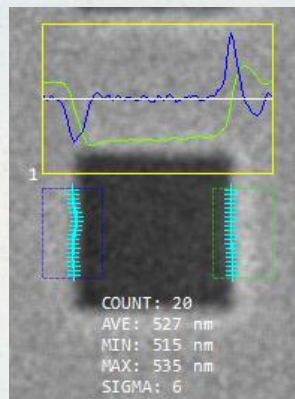
【直径測長】



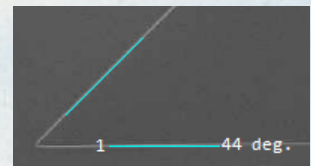
【定線-膜厚測長】



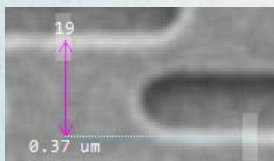
【広範囲測長】



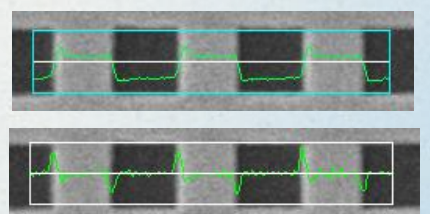
【角度測定】



【垂直/水平2点測長】



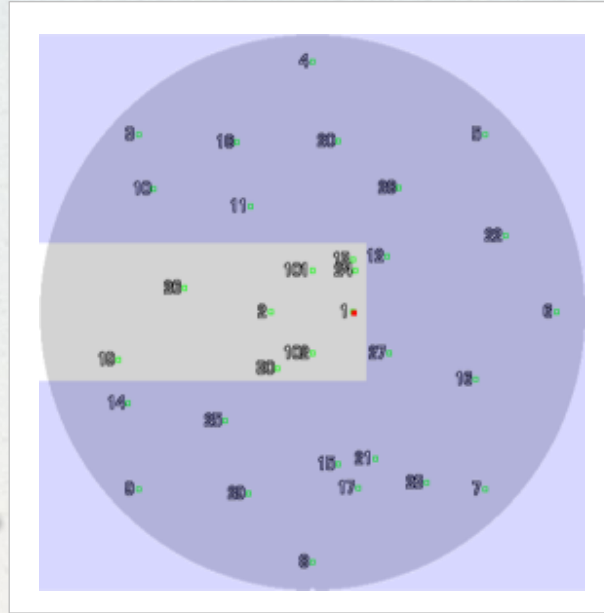
【輝度/エッジプロファイル】



Wafer / HDDレビュー

ウェハ/HDDの表面検査装置にて検出された欠陥データを読み込んで欠陥検査位置のナビゲーションが行えます。

Wafer / 表面検査装置



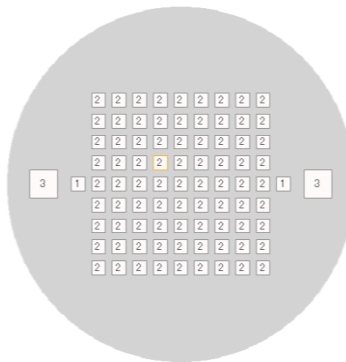
EB/CADナビゲーション

チップ配列定義ファイル及びCADデータを読み込んでCADのナビゲーションが行えます。

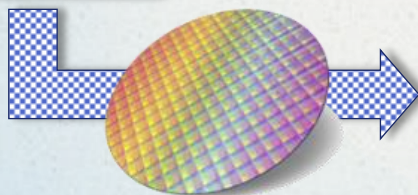
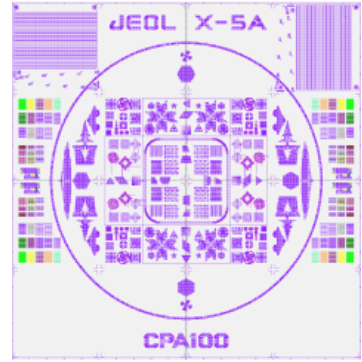
JBX



Job Deck File

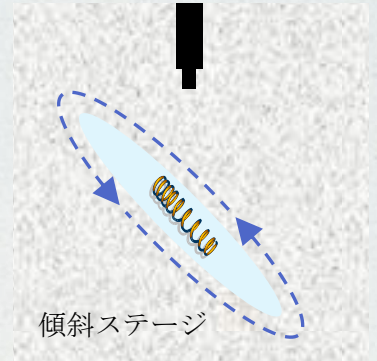


JEOL52 GDS-II/DXF

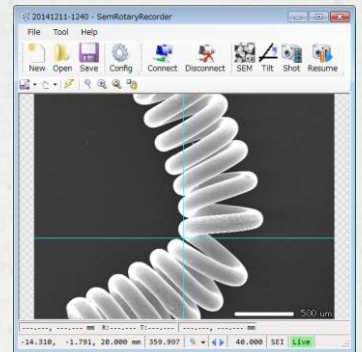
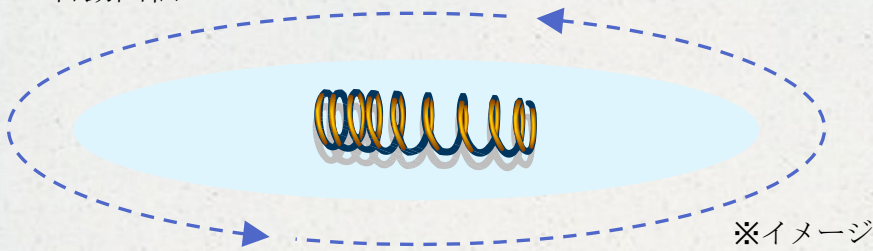


360度回転画像撮影

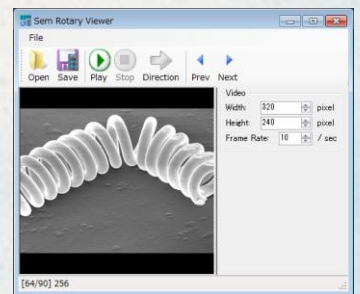
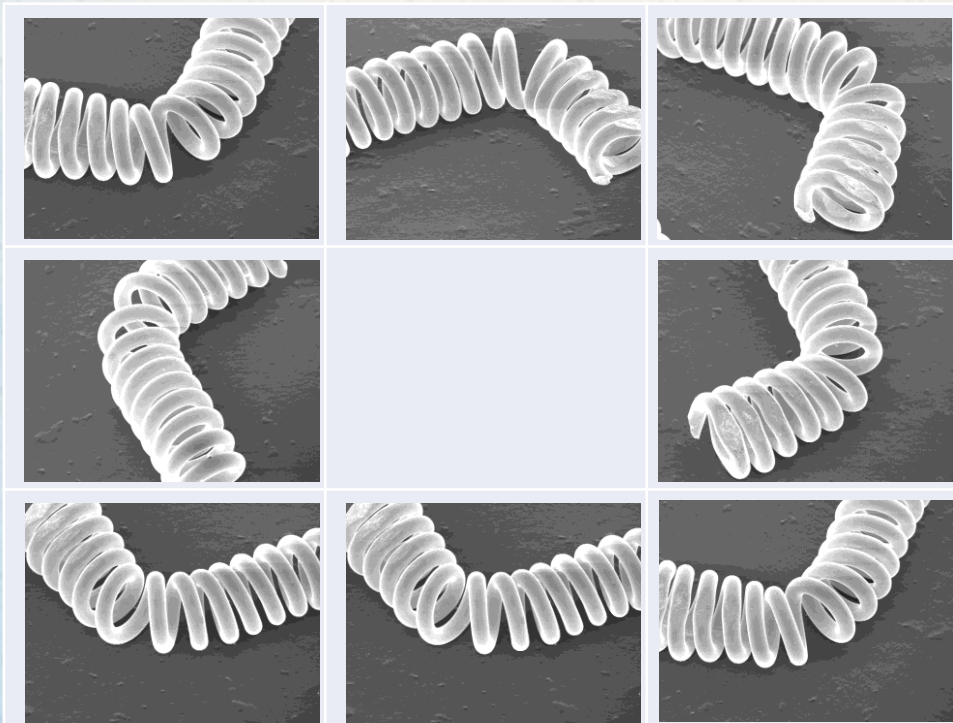
ステージを傾けた状態で360度の回転画像を自動で撮影します。



自動回転



回転表示



撮影した画像は動画として保存する事が出来ます。

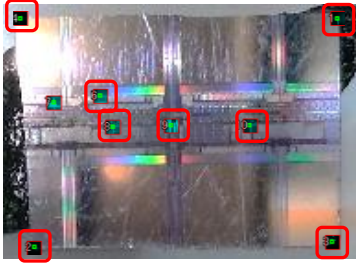
最大撮影枚数:360枚

拡張機能

光学顕微鏡リンケージ

オプション

サンプル



撮影

デジタルカメラ

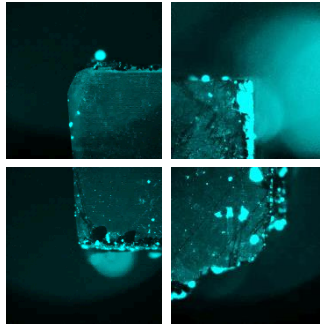


モーター駆動
ステージ

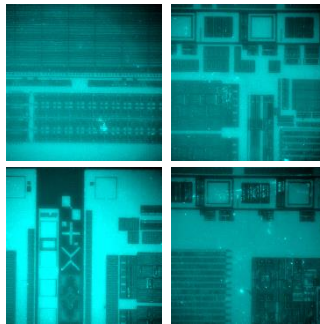
OM

出力

アライメント用画像

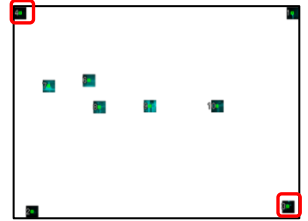


観察用画像(座標位置付)



入力

【観察点配置】



アライメント調整

【観察点一覧】

ID	Vis	MA	LOK	XREL	YREL	XSTGPOS	YSTGPOS
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-0.661	-0.661	0.000	0.000
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.074	0.074	0.000	0.000
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-0.843	0.000	0.000	0.000
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.061	-0.063	0.000	0.000
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.296	-1.582	0.000	0.000
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.296	-1.582	0.000	0.000
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.256	-1.285	0.000	0.000
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.294	-0.259	0.000	0.000
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.317	-0.307	0.000	0.000
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2.976	-0.387	0.000	0.000

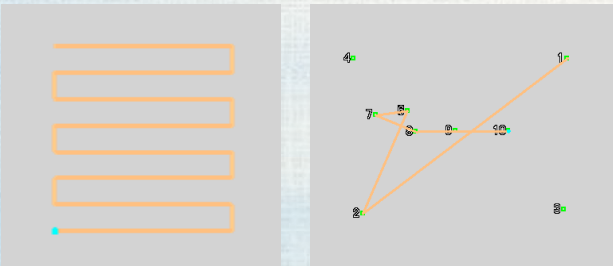


サンプル上で確認できる位置をアライメント点として利用する事が出来るため特別なホルダーは必要ありません。アライメント調整後、観察点に移動する事がスムーズに出来ます。

データ提供: Leica Microsystems GmbH

ステージ追跡

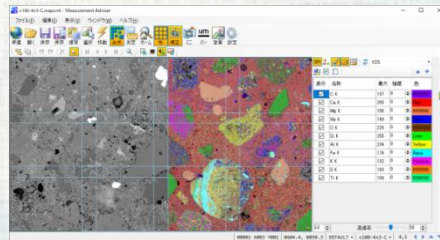
オプション



ステージが移動した軌跡を記憶する事によって、既に観察した位置を目視にて確認する事が出来ます。

EDSリンケージ

オプション



SEM像と分析像を重ねて表示する事ができます。

*IT100/JED-2300のみ

経時変化の観察

オプション



撮影

撮影

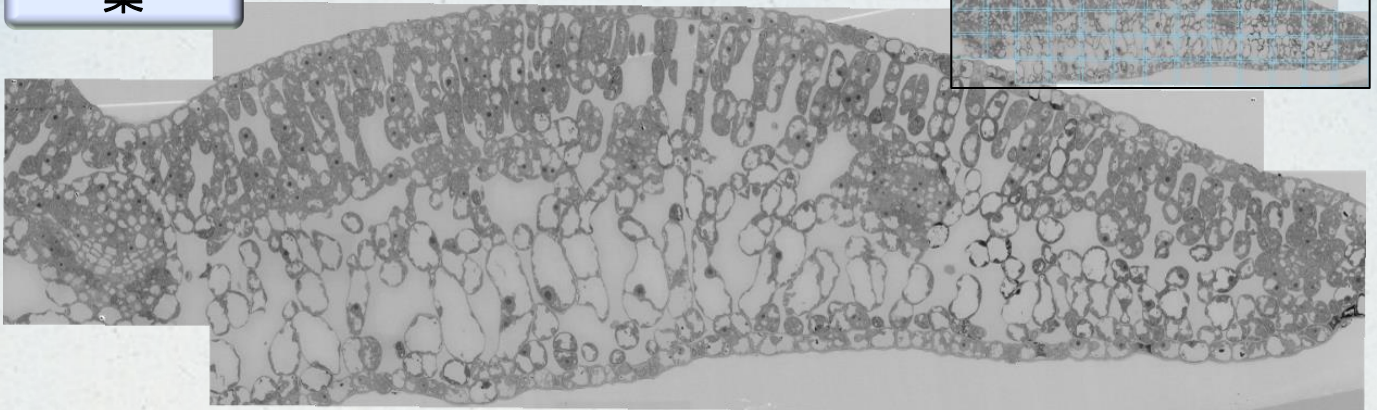
撮影



撮影した画像は動画として保存する事ができます。

ギャラリー

葉



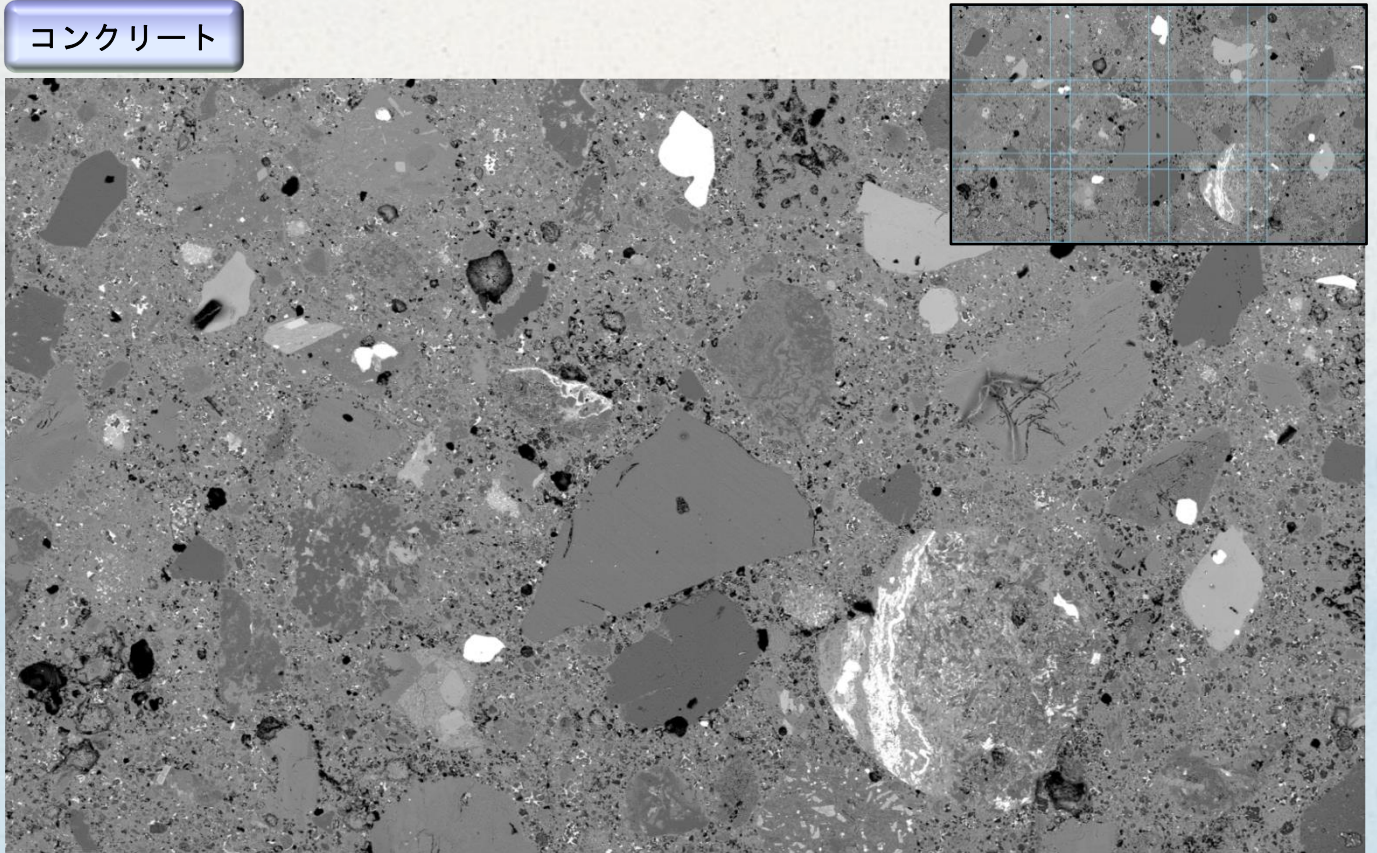
データ提供: 日本電子株式会社

CP断面



データ提供: 日本電子株式会社

コンクリート



データ提供: 日本電子株式会社

このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更になる事があります。

株式会社システムインフロンティア

所在地 〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-3 新鈴春ビル4F
電話番号 042-526-4364
FAX番号 042-526-4370
URL <http://temography.com/>



TEMography
.com

